

СВЕДЕНИЯ ОБ ОППОНЕНТЕ

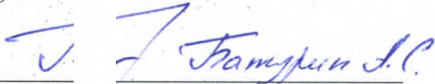
по докторской диссертации Муслимова А.Э. «Управляемая перестройка поверхности кристаллических подложек для формирования эпитаксиальных наноструктур» по специальности 01.04.18 – «Кристаллография, физика кристаллов»

Фамилия, имя, отчество оппонента	Тодуа Павел Андреевич
Дата рождения	10 июня 1941 г.
Шифр и наименование специальности, по которым защищена диссертация	01.04.10 – физика полупроводников
Ученая степень и отрасль науки	Доктор физико-математических наук, физика
Ученое звание	Профессор
Полное наименование организации, являющейся основным местом работы оппонента	Федеральное государственное унитарное предприятие Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений
Почтовый адрес с указанием индекса	119361, Москва, Озерная 46, корпус 1
Занимаемая должность	Ведущий научный сотрудник
Телефон	8(903)7407919
Адрес электронной почты	paveltodua@mail.ru
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет	<ol style="list-style-type: none"> 1. NOVEL METHOD FOR DIMENSIONAL MEASUREMENTS OF NANORELIEF ELEMENTS BASED ON ELECTRON PROBE DEFOCUSING IN A SCANNING ELECTRON MICROSCOPE <i>Filippov M.N., Gavrilenko V.P., Mityukhlyayev V.B., Rakov A.V., Todua P.A.</i> Measurement Science and Technology. 2014. Т. 25. № 4. С. 044008. 2. АНИЗОТРОПИЯ РАБОТЫ ВЫХОДА ЭЛЕКТРОНОВ И ПОВЕРХНОСТНАЯ ЭНЕРГИЯ МЕТАЛЛОВ <i>Бокарев В.П., Горнев Е.С., Красников Г.Я., Тодуа П.А.</i> Электронная техника. Серия 3: Микроэлектроника. 2014. № 1 (156). С. 18-20. 3. ТРЕХМЕРНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕЛЬЕФНЫХ СТРУКТУР ПО СТЕРЕОИЗОБРАЖЕНИЯМ, ПОЛУЧЕННЫМ В РАСТРОВОМ ЭЛЕКТРОННОМ МИКРОСКОПЕ <i>Гавриленко В.П., Карабанов Д.А., Кузин А.Ю., Митюхляев В.Б., Михуткин А.А., Тодуа П.А., Филиппов М.Н., Баймухаметов Т.Н., Васильев А.Л.</i> Измерительная техника. 2015. № 3. С. 15-18. 4. ОБРАЗОВАНИЕ ОКИСНОЙ ПЛЕНКИ НА ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЕВОЙ РЕЛЬЕФНОЙ СТРУКТУРЫ В ПРОЦЕССЕ ПЛАЗМЕННОЙ ОЧИСТКИ <i>Гавриленко В.П., Кузин А.Ю., Митюхляев В.Б., Степович М.А., Тодуа П.А., Филиппов М.Н., Карабанов Д.А.</i> Измерительная техника. 2015. № 8. С. 71-72.

5. ИЗМЕРЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ОКСИДНОЙ ПЛЕНКИ НА ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЯ ЭЛЕКТРОННО-ЗОНДОВЫМ МЕТОДОМ
Гавриленко В.П., Кузин А.Ю., Митюхляев В.Б., Степович М.А., Тодуа П.А., Филиппов М.Н.
Измерительная техника. 2015. № 9. С. 13-16.
6. ИЗМЕРЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПО ЭМИССИОННЫМ РЕНТГЕНОВСКИМ СПЕКТРАМ ПРИ ЭНЕРГОДИСПЕРСИОННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
Гавриленко В.П., Заблоцкий А.В., Корнейчук С.А., Кузин А.Ю., Куприянова Т.А., Лямина О.И., Тодуа П.А., Филиппов М.Н., Шкловер В.Я.
Измерительная техника. 2016. № 2. С. 65-67.
7. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПОГРЕШНОСТЬ ТРЁХМЕРНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ОБЪЕКТОВ С СУБМИКРОМЕТРОВЫМ РЕЛЬЕФОМ, ПО ПОЛУЧЕННЫМ В РАСТРОВОМ ЭЛЕКТРОННОМ МИКРОСКОПЕ СТЕРЕОИЗОБРАЖЕНИЯМ
Кузин А.Ю., Васильев А.Л., Митюхляев В.Б., Михуткин А.А., Тодуа П.А., Филиппов М.Н.
Измерительная техника. 2016. № 3. С. 20-23.
8. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТРЁХМЕРНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ РЕЛЬЕФНЫХ СТРУКТУР ПО СТЕРЕОИЗОБРАЖЕНИЯМ, ПОЛУЧЕННЫМ В РАСТРОВОМ ЭЛЕКТРОННОМ МИКРОСКОПЕ
Кузин А.Ю., Васильев А.Л., Карабанов Д.А., Митюхляев В.Б., Михуткин А.А., Пресняков М.Ю., Тодуа П.А., Филиппов М.Н.
Измерительная техника. 2016. № 8. С. 21-24.
9. ИЗМЕРЕНИЕ НЕОДНОРОДНОСТИ ТОЛЩИНЫ НАНОПЛЁНОК ЭЛЕКТРОННО-ЗОНДОВЫМ МЕТОДОМ
Дарзбек С.А., Кузин А.Ю., Митюхляев В.Б., Степович М.А., Тодуа П.А., Филиппов М.Н.
Измерительная техника. 2016. № 8. С. 24-26.
10. ТЕПЛОВЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРИ НИЗКОВОЛЬТНОМ ЭЛЕКТРОННО-ЗОНДОВОМ РЕНТГЕНСПЕКТРАЛЬНОМ МИКРОАНАЛИЗЕ С НАНОМЕТРОВОЙ ЛОКАЛЬНОСТЬЮ
Кузин А.Ю., Степович М.А., Митюхляев В.Б., Тодуа П.А., Филиппов М.Н.
Измерительная техника. 2016. № 10. С. 27-29.
11. ИЗМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА АНАЛИЗИРУЕМОГО ОБЪЕКТА ПРИ НИЗКОВОЛЬТНОМ ЭЛЕКТРОННО-ЗОНДОВОМ РЕНТГЕНСПЕКТРАЛЬНОМ МИКРОАНАЛИЗЕ
Кузин А.Ю., Митюхляев В.Б., Тодуа П.А., Филиппов М.Н.
Измерительная техника. 2016. № 11. С. 68-70.
12. КАЛИБРОВКА РАСТРОВЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ МИКРОСКОПОВ В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ УВЕЛИЧЕНИЙ
Киртаев Р.В., Кузин А.Ю., Маслов В.Г., Митюхляев В.Б., Тодуа П.А., Филиппов М.Н.
Измерительная техника. 2016. № 12. С. 7-10.
13. ОЦЕНКА СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОГРЕШНОСТИ РЕНТГЕНСПЕКТРАЛЬНОГО МИКРОАНАЛИЗА, ОБУСЛОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТНЫМ РЕЛЬЕФОМ ОБРАЗЦА
Васильев А.Л., Митюхляев В.Б., Михуткин А.А., Тодуа П.А., Филиппов М.Н.
Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2016. Т. 82. № 12. С. 15-18.
14. ИЗМЕРЕНИЕ ВЫСОТЫ ЭЛЕМЕНТОВ НАНОРЕЛЬЕФА ПОВЕРХНОСТИ МЕТОДОМ ТРЁХМЕРНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ В РАСТРОВОМ ЭЛЕКТРОННОМ МИКРОСКОПЕ
Дарзбек С.А., Карабанов Д.А., Кузин А.Ю., Митюхляев В.Б., Тодуа П.А., Филиппов М.Н.
Измерительная техника. 2017. № 3. С. 15-18.
15. ТЕПЛОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ЗОНДА ПРИ РЕНТГЕНСПЕКТРАЛЬНОМ НАНОАНАЛИЗЕ
Амрастанов А.Н., Кузин А.Ю., Митюхляев В.Б., Серегина Е.В., Степович М.А., Тодуа П.А., Филиппов М.Н.
Измерительная техника. 2017. № 6. С. 13-15.

16. ЭЛЕКТРОННО-ЗОНДОВЫЙ РЕНТГЕНСПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАНОЧАСТИЦ
Дарзбек С.А., Митюхляев В.Б., Тодуа П.А., Филиппов М.Н.
Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2017. Т. 83. № 8. С. 5-9.
17. ЭЛЕКТРОННО-ЗОНДОВЫЙ РЕНТГЕНСПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАНОПЛЕНОК ПРИ
НАКЛОННОМ ПАДЕНИИ ПУЧКА ЭЛЕКТРОНОВ
Дарзбек С.А., Митюхляев В.Б., Тодуа П.А., Филиппов М.Н.
Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2017. Т. 83. № 9. С. 5-9

Верно



(подп

Дата

22.06.18

